

2008 年応用物理学会九州支部学術講演会

特別共通セミナー「応用物理学関連測定技術の最前線」

日時：平成 20 年 11 月 29 日(土) 15 時 00 分～18 時 00 分

場所：宮崎大学 木花キャンパス

< プ ロ グ ラ ム >

座長 九州工業大学 大学院情報工学研究院
古川 昌司

G 会場

Sc-1 薄膜材料における X 線回折法 (15:00 - 15:30)
(株)リガク 応用技術センター
屋代 恒 氏

(休憩 15 分)

A 会場

Sc-2 収差補正の原理と応用 (15:45 - 16:15)
日本電子(株) 電子光学事業本部
近藤 行人 氏

Sc-3 プローブ顕微鏡(SPM)による局所分析(STM 発光を中心に) (16:15 - 16:45)
九州工業大学 大学院工学研究院
西谷 龍介 氏

(休憩 15 分)

Sc-4 圧電素子光熱変換分光法による半導体材料評価 (17:00 - 17:30)
宮崎大学 工学部
福山 敦彦 氏

Sc-5 感性ナノバイオセンサ (17:30 - 18:00)
九州大学 大学院システム情報科学研究院
都甲 潔 氏